

## 6. SERVIZO DE NANOTECNOLOXÍA E ANÁLISE DE SUPERFICIES

### 6.1 UNIDADE DE ESPECTROSCOPIA DE FOTOELECTRÓNS DE RAIOS X E ESPECTROSCOPIA AUGER

Código	Concepto	2010	
		B	C
6.1.1	Hora XPS	45	90

### 6.2 UNIDADE DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS POR TEMPO DE VOO (TOF-SIMS)

Código	Concepto	2010	
		B	C
6.2.1	Hora TOF-SIMS	45	90

### 6.3 UNIDADE DE MICROSCOPIA DE PROXIMIDADE

Código	Concepto	2010	
		B	C
6.3.1	Hora AFM-STM	30	60

### 6.4 UNIDADE DE NANOINDENTACIÓN

Código	Concepto	2010	
		B	C
6.4.1	Hora NANOINDENTADOR	30	60

### 6.5 UNIDADE DE PERFILOMETRÍA

Código	Concepto	2010	
		B	C
6.5.1	Hora PERFILÓMETRO Interferométrico*	25	50
6.5.2	Hora PERFILÓMETRO Mecánico*	12	24

\*Inclúe un técnico operador do equipo

**NOTA:** As horas de procesamento dos resultados experimentais- cando o requira o solicitante- contabilizaráanse como horas experimentais adicionais.